



POLITECHNIKA ŁÓDZKA

XV Krajowa
VI Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna

METROLOGIA W TECHNIKACH WYTWARZANIA

METROLOGY IN PRODUCTION ENGINEERING



17-19.09.2014 r.
Łódź - Uniejów

KOMUNIKAT I

MIEJSCE KONFERENCJI

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie
ul. Zamkowa 2
99-210 Uniejów

www.termuniejow.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI

Politechnika Łódzka
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

tel.: (42) 631 22 99

fax: (42) 636 57 26

www.mwtw.p.lodz.pl

e-mail: mwtw@info.p.lodz.pl

FORMA OBRAD

- sesje plenarne
- obrady w sekcjach tematycznych
- sesja posterowa
- prezentacje firm, producentów aparatury pomiarowej
- wystawa sprzętu pomiarowego

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Politechnika Łódzka

KOSZT KONFERENCJI

Opłata konferencyjna wynosi 1700 zł.

Opłata obejmuje wszystkie koszty uczestnika związane z konferencją, w tym: materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach, przerwy kawowe, śniadania, obiady, przyjęcie powitalne, uroczystą kolację, nocleg oraz transport z Łodzi do Uniejowa i z powrotem.

Warunkiem druku referatu jest wniesienie opłaty konferencyjnej, przez co najmniej jednego autora/współautora. Jedna opłata konferencyjna odpowiada jednemu referatowi.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Wszystkie referaty będą recenzowane i wydane w materiałach konferencyjnych w formie książkowej oraz na płycie CD w czasopiśmie Mechanik (6 pkt. wg listy MNiSW).

TERMINARZ

24.03.2014 – nadesłanie karty zgłoszeniowej oraz streszczeń referatów

31.03.2014 – komunikat II z potwierdzeniem przyjęcia referatu oraz wymaganiami redakcyjnymi

15.04.2014 – nadesłanie pełnych tekstów referatów

01.06.2014 – zakwalifikowanie referatów do druku po recenzji

15.06.2014 – wniesienie opłat za uczestnictwo

15.07.2014 – komunikat III z programem konferencji

PATRONAT HONOROWY

J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk

Inicjator Konferencji, Honorowy Przewodniczący
Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka

czł. koresp. PAN, Przewodniczący Komitetu Metrologii
i Aparatury Naukowej PAN

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik

Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

Komitet Budowy Maszyn PAN

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

(Politechnika Świętokrzyska) – Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński

(Wydział Mechaniczny PŁ) – Wiceprzewodniczący

Dr hab. inż. Krzysztof Józwik, prof. nadzw. PŁ

(Wydział Mechaniczny PŁ) – Wiceprzewodniczący

Prof. dr inż. Jan Chajda (PWSZ Kalisz)

Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (PW)

Prof. dr inż. Miroslav Dovica (Uniwersytet Techniczny
Koszycy)

Prof. dr Numan Durakbasa (Techniczny Uniwersytet w
Wiedniu)

Doc. Rudolf Dvorak (Techniczny Uniwersytet w Pradze)

Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (PK)

Prof. dr hab. inż. Wit Grzesik (PO)

Dr hab. inż. Tadeusz Iglantowicz prof. PS (ZUT)

Dr hab. inż. Władysław Jakubiec prof. ATH (ATH)

Prof. dr inż. Alexander Janac (Słowacki Uniwersytet
Techniczny w Bratysławie)

Prof. dr inż. Tadeusz Karpiński (PKo)

dr hab. inż. Czesław Łukianowicz prof. PKo (PKo)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Marchelek (ZUT)

Dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, prof. nadzw. PŁ (PŁ)

Prof. dr hab. inż. Thomas Mathia (EC Lyon)

Prof. dr hab. inż. Bogdan Nowicki (PW)

Prof. dr Michał Obmascik (Uniwersytet Aleksandra
Dubczeka w Trencinie)

Dr hab. inż. Aleksander Olczyk (PŁ)

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus (PRz)

Prof. dr hab. inż. Stanisław Płaska (PL)

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski (PG)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko (PW)

Doc. Stanislav Turek (Uniwersytet w Zilinie)

Prof. dr Herbert Osanna (Techniczny Uniwersytet w
Wiedniu)

Dr hab. inż. Jerzy Stadek prof. PK (PK)

Dr hab. inż. Roman Staniek prof. PP (PP)

Prof. dr hab. inż. Jan Szadkowski (ATH)

Prof. dr Josu Takala (Uniwersytet Vaasa, Finlandia)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz (PCz)

Prof. dr inż. Albert Weckenmann (Uniwersytet Friedrich-
Alexander Erlangen-Norymberga, Niemcy)

Prof. dr inż. Henryk Żebrowski (PW r)

Dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucy prof. PW (PW)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Dr hab. inż. Aleksander Olczyk

Sekretarz:

Dr inż. Wojciech Stachurski

Dr inż. Tomasz Pałczyński

Członkowie:

Dr hab. inż. Tadeusz Marciniak, prof. nadzw. PŁ

Dr inż. Małgorzata Gizelska

Dr inż. Piotr Zgórniak

Mgr inż. Anna Grdulska

TEMATYKA KONFERENCJI

- Aparatura i systemy pomiarowe
- Metrologia w systemach zapewnienia jakości
- Geometria powierzchni w skali makro, mikro i nano
- Współrzędnościowa technika pomiarowa
- Techniki pomiarowe w analizie procesów i urządzeń technologicznych
- Metrologia w różnych obszarach zastosowań
- Inżynieria odwrotna

JĘZYKI OBRAD

Język polski

Język angielski

KOMUNIKAT I